



SeAP-IAP
[Sociedad Española de Anatomía Patológica]
[International Academy of Pathology]



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA (SEAP)
Y
ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLÓGIA (AEDV)

PREMIOS:

MEJORES APORTACIONES CIENTÍFICAS

Bases y criterios de valoración

BASES DEL PREMIO

La Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) y la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), constituyen dos organizaciones sin ánimo de lucro que entre sus fines promueven e incentivan los estudios e investigaciones; con la concesión de becas y premios.

La Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) y la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), convocan los premios que se concederán a la mejor aportación científica y 2 accésit.

La dotación económica de los premios será:

| | |
|-----------------------------|------------|
| Mejor aportación científica | 1.000,00 € |
| Primer Accésit | 500,00 € |
| Segundo Accésit | 500,00 € |

CRITERIOS DE VALORACIÓN

- 1- Podrán optar todos los participantes en la Reunión. Los candidatos deberán ser miembros de la Sociedad Española de Anatomía Patológica o de la Academia Española de Dermatología y Venereología.
- 2- El jurado estará compuesto por 5 personas designadas a tal efecto: Dres. Alicia Córdoba Iturriagoitia, María Teresa Fernández Figueras, Juan José Ríos Martín, Onofre Sanmartín Jiménez e Ignacio Yanguas Bayona, y su decisión será inapelable.
- 3- El fallo será comunicado por la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) y la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y entregado a los premiados durante la 44ª Reunión del Grupo Español de Dermatopatología, que tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre 2018 en Pamplona.
- 4- El autor será el responsable de la originalidad del trabajo presentado y de todo su contenido. El autor exime en su caso a la SEAP y AEDV de cualquier reclamación en concepto de autoría y explotación patrimonial del material presentado.
- 5- La no aceptación de estas bases conllevará la desestimación del trabajo.